Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И НАНОСИСТЕМ

ОДОБРЕНО

УМС ЛАПЛАЗ Протокол №1/08-577 от 29.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ

Направление подготовки (специальность)

[1] 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
8	2	72	0	0	45		27	0	3
Итого	2	72	0	0	45	24	27	0	

АННОТАЦИЯ

В курсе даются сведения о различных низкоразмерных физических системах. Рассматриваются методы их приготовления и исследования. Основное внимание уделяется технике проведения физических экспериментов с низкоразмерными объектами. Обсуждаются основные области применения наноструктур.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дать студентам базовые знания по свойствам наноразмерных объектов, экспериментальной технике получения, исследования и практического применения наноструктур.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Данная дисциплина даёт необходимые знания по физике низкоразмерных систем и готовит к проведению НИР и экспериментальной исследовательской работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
	научно-ис	сследовательский	
проведение научных	результаты	ПК-1.3 [1] - Способен	3-ПК-1.3[1] - знать
и аналитических	исследований и	проводить научно-	возможности
исследований по	расчётов, анализ	техническую разработку	экспериментальных
отдельным разделам	мирового опыта,	и методическое	методов физики
(этапам, заданиям)	математические	сопровождение в области	твердого тела в
темы (проекта) в	модели явлений и	создания	области
рамках предметной	процессов	наноструктурированных	метаматериалов и
области по профилю		композиционных	низкоразмерных
специализации в		материалов	структур;
соответствии с			У-ПК-1.3[1] - уметь
утвержденными		Основание:	предложить схему
планами и		Профессиональный	эксперимента и
методиками		стандарт: 40.037, 40.041	теоретическую

исследований; участие в проведении наблюдений и измерений, выполнении эксперимента и обработке данных с использованием современных компьютерных технологий; сбор и анализ информационных источников и исходных данных для планирования и разработки исследовательских проектов; проведение фундаментальных и прикладных математических и физических исследований, направленных на решение инженерных, технических и информационных задач; выбор методов и подходов к решению поставленной научной проблемы, формулировка математической модели явления, аналитические и численные расчеты; создание программ и комплексов программ на базе стандартных пакетов для выполнения расчетов в рамках математических моделей, участие в разработке новых алгоритмов и компьютерных программ для

модель при разработке новых метаматериалов и низкоразмерных структур; В-ПК-1.3[1] - владеть современными теоретическими моделями для описания низкоразмерных систем и наноструктур

научноисследовательских и прикладных целей; изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, сбор и обработка научной и аналитической информации с использованием современных программ, средств и методов вычислительной математики, компьютерных и информационных технологий; сбор и обработка научной и аналитической информации с использованием современных программ, средств и методов вычислительной математики, компьютерных и информационных технологий; участие в проведении теоретических исследований, построении физических, математических и компьютерных моделей изучаемых процессов и явлений, в проведении участие в обобщении полученных данных, формировании выводов, в подготовке научных и аналитических отчетов, публикаций и презентаций

DODUM TOTOR HOLINIA			
результатов научных			
и аналитических			
исследований.	# ADVIVE MOTELY	ПК-1.4 [1] - Способен	3-ПК-1.4[1] - знать
проведение научных	результаты исследований и		
и аналитических		проводить	задачи и возможности
исследований по	расчётов, анализ	экспериментальные	современной
отдельным разделам	мирового опыта,	исследования для	экспериментальной
(этапам, заданиям)	математические	создания новой	техники в области
темы (проекта) в	модели явлений и	оптотехники, оптических	оптотехники и
рамках предметной	процессов	и оптико-электронных	оптоэлектроники;
области по профилю		приборов и комплексов	У-ПК-1.4[1] - уметь
специализации в			обрабатывать,
соответствии с		Основание:	представлять и
утвержденными		Профессиональный	интерпретировать
планами и		стандарт: 40.037	экспериментальные
методиками			данные;
исследований;			В-ПК-1.4[1] - владеть
участие в проведении			специализированной
наблюдений и			научной аппаратурой
измерений,			в области физики
выполнении			твердого тела,
эксперимента и			наноразмерных
обработке данных с			структур и
использованием			метаматериалов,
современных			навыками снятия
компьютерных			результатов
технологий; сбор и			измерений, их
анализ			обработки и
информационных			представления
источников и			
исходных данных			
для планирования и			
разработки			
исследовательских			
проектов;			
проведение			
фундаментальных и			
прикладных			
математических и			
физических			
исследований,			
направленных на			
решение			
инженерных, технических и			
информационных			
задач; выбор			
методов и подходов к			
решению			
поставленной			
научной проблемы,			
формулировка			
формулировка			

математической модели явления, аналитические и численные расчеты; создание программ и комплексов программ на базе стандартных пакетов для выполнения расчетов в рамках математических моделей, участие в разработке новых алгоритмов и компьютерных программ для научноисследовательских и прикладных целей; изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, сбор и обработка научной и аналитической информации с использованием современных программ, средств и методов вычислительной математики, компьютерных и информационных технологий; сбор и обработка научной и аналитической информации с использованием современных программ, средств и методов вычислительной математики, компьютерных и информационных технологий; участие в проведении теоретических

исследований, построении физических, математических и компьютерных моделей изучаемых процессов и явлений, в проведении участие в обобщении полученных данных, формировании выводов, в подготовке научных и аналитических отчетов, публикаций и презентаций результатов научных и аналитических исследований. Разработка лазерных и оптических технологий; анализ поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики; экспериментальные исследования в области фотоники и оптоинформатики новых явлений, материалов, систем и устройств	Лазерные технологии, элементы в составе лазерных систем, оптические материалы и детали, дифракционные оптические элементы, голограммы	ПК-1 [1] - способен к анализу поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики Основание: Профессиональный стандарт: 29.004, 40.037	3-ПК-1[1] - Знать современное состояние развития фотоники и оптоинформатики; У-ПК-1[1] - уметь анализировать исходные требования при решении задач в области фотоники и оптоинформатики проводить поиск научнотехнической информации по теме решаемой задачи уточнять и корректировать требования к решаемой задаче в области фотоники и оптоинформатики; В-ПК-1[1] - Владеть навыками анализа простых исследовательских задач в области фотоники и
			фотоники и оптоинформатики
	палектил_	 конструкторский	оптоинформатики
Проектирование и	Элементная база	ПК-4 [1] - способен к	3-ПК-4[1] - Знать
конструирование оптических	фотоники и оптоинформатики и	анализу, расчету, проектированию и	основные правила разработки проектной
технологий	цифровые методы	конструированию в	и рабочей

передачи, приема, анализа соответствии с технической обработки, хранения техническим заданием документации, и отображения правила оформления типовых систем, информации; участие приборов, деталей и конструкторской в монтаже, наладке, узлов на документации испытаниях и сдаче в принципы и методы схемотехническом и эксплуатацию элементном уровнях; расчета и опытных образцов проектирования Основание: изделий, узлов, деталей и узлов элементов приборов Профессиональный приборов и установок и систем фотоники и стандарт: 06.007, 29.004 в соответствии с оптоинформатики техническим заданием.; У-ПК-4[1] - Уметь анализировать технические требования, предъявляемые к разрабатываемым узлам и элементам рассчитывать и проектировать детали и узлы приборов и установок, разрабатывать проекты технических описаний установок и приборов, проводить концептуальную и проектную проработку типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях; В-ПК-4[1] - Владеть методами анализа и расчета, навыками конструирования и проектирования в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях, методами расчета и проектирования деталей и узлов приборов и установок с использованием

	стандартных средств
	автоматизации

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование чувства личной	профессионального модуля для
	ответственности за научно-	формирования чувства личной
	технологическое развитие	ответственности за достижение
	России, за результаты	лидерства России в ведущих
	исследований и их последствия	научно-технических секторах и
	(B17)	фундаментальных исследованиях,
		обеспечивающих ее
		экономическое развитие и
		внешнюю безопасность,
		посредством контекстного
		обучения, обсуждения социальной
		и практической значимости
		результатов научных исследований
		и технологических разработок.
		2.Использование воспитательного
		потенциала дисциплин
		профессионального модуля для
		формирования социальной
		ответственности ученого за
		результаты исследований и их
		последствия, развития
		исследовательских качеств
		посредством выполнения учебно-
		исследовательских заданий,
		ориентированных на изучение и
		проверку научных фактов,
		критический анализ публикаций в
		профессиональной области,
		вовлечения в реальные
		междисциплинарные научно-
		исследовательские проекты.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин/практик
	формирование научного	«Научно-исследовательская
	мировоззрения, культуры	работа», «Проектная практика»,
	поиска нестандартных научно-	«Научный семинар» для:
	технических/практических	- формирования понимания
	решений, критического	основных принципов и способов
	отношения к исследованиям	научного познания мира, развития
	лженаучного толка (В19)	исследовательских качеств
	mondy more residue (D17)	студентов посредством их
		вовлечения в исследовательские
		проекты по областям научных

исследований. 2.Использование
воспитательного потенциала
дисциплин "История науки и
инженерии", "Критическое
мышление и основы научной
коммуникации", "Введение в
специальность", "Научно-
исследовательская работа",
"Научный семинар" для:
- формирования способности
отделять настоящие научные
исследования от лженаучных
посредством проведения со
студентами занятий и регулярных
бесед;
- формирования критического
мышления, умения рассматривать
различные исследования с
экспертной позиции посредством
обсуждения со студентами
современных исследований,
исторических предпосылок
появления тех или иных открытий
и теорий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	8 Семестр						
1	Раздел 1	1-8	0/0/24		25	КИ-8	3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-1.3, У-ПК-1.3, В-ПК-1.4, У-ПК-1.4, В-ПК-1.4, 3-ПК-4, У-ПК-4,

						В-ПК-4
2	Раздел 2	9-15	0/0/21	25	КИ-12	3-ПК-1,
						У-ПК-1,
						В-ПК-1,
						3-ПК-1.3,
						У-ПК-1.3,
						В-ПК-1.3,
						3-ПК-1.4,
						У-ПК-1.4,
						В-ПК-1.4,
						3-ПК-4,
						У-ПК-4,
						В-ПК-4
	Итого за 8 Семестр		0/0/45	50		
	Контрольные			50	3	3-ПК-1,
	мероприятия за 8					У-ПК-1,
	Семестр					В-ПК-1,
						3-ПК-1.3,
						У-ПК-1.3,
						В-ПК-1.3,
						3-ПК-1.4,
						У-ПК-1.4,
						В-ПК-1.4,
						3-ПК-4,
						У-ПК-4,
						В-ПК-4

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
3	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
		час.	час.	час.
	8 Семестр	0	0	45
1-8	Раздел 1	0	0	24
1 - 2	Тема 1. Введение	Всего а	удиторных	часов
	Место наноразмерных объектов в окружающем нас мире.	0	0	6
	Подходы «снизу в вверх» и «сверху вниз». Манипуляции	ляции Онлайн		
	на квантовом уровне. Низкоразмерные физические	0	0	0
	системы. Квантовая механика – основа физики			
	наноразмерных структур. Типы и виды наноструктур.			
	Квантовые ямы, проволоки, точки.			
3 - 4	Тема 2. Методы приготовления наноструктур	Всего а	удиторных	часов

^{**} – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

	Понятие эпитаксии. Соизмеримость решеток. Лазерное и	0	0	6		
	магнетронное распыление. Принципы молекулярно-	Онлай	_			
	лучевой эпитаксии. Особенности МЛЭ. Критическая	0	0	0		
	температура эпитаксии. Оптическая, электронная и					
	рентгеновская литография. Методы изготовления					
	электрических контактов.					
5	Тема 3. Электрические методы исследования.	Всего	аудиторні	ых часов		
	Вольт-амперные характеристики. Особенности двух и	0	0	3		
	четырехконтактой схемы измерений. Классический	Онлай	H	"		
	эффект Холла в случае одного и двух типов носителей.	0	0	0		
	Метод Ван-дер-Пау.					
6	Тема 4 Оптические методы исследования	Всего	аудиторні	ых часов		
	наноструктур.	0	0	3		
	Понятие люминесценции. Флуоресценция,	Онлай	H	•		
	фосфоресценция, фотолюминесценция,	0	0	0		
	электролюминесценция, радиолюминесценция,					
	хемилюминесценция, кандолюминесценция. Осо-бенности					
	фотолюминесценции. Стоксовые потери. Люминесценция					
	свободных экситонов. Фононные повторения. Экситонно-					
	примесные уровни. Идентификация примесей.					
	Фотолюминесценция квантово-размерных структур.					
7 - 8	Тема 5. Автоэлектронная и автоионная эмиссия.	Всего	аудиторні	удиторных часов		
	Физические основы автоэлектронной эмиссии. Теория	0	0	6		
	Фаулера-Нордгейма. Полевая эмиссионная микроскопия.	Онлай	H			
	Автоэлектронный и автоионный микроскопы. Увеличение	0	0	0		
	и разрешение эмиссионных микроскопов. Требование к					
	игле. Основные направления автоэмиссионных					
	исследований.					
9-15	Раздел 2	0	0	21		
9 - 10	Тема 6. Сканирующая зондовая микроскопия	Всего	аудиторні	ых часов		
	нанообъектов.	0	0	6		
	Принципы зондовой микроскопии. Сканирующий	Онлай	H			
	туннельный микроскоп. Режимы обрат-ной связи.	0	0	0		
	Параметры, влияющие на туннельный ток. Принципы					
	атомно-силовой микроскопия. Контактная,					
	полуконтактная, бесконтакная моды.					
11 - 12	Тема 7. Просвечивающая электронная микроскопия	Всего	аудиторні	ых часов		
	высокого разрешения.	0	0	6		
	Принцип работы просвечивающего электронного	Онлай	Ή			
i e						
	микроскопа. Реплики. Контраст.	0	0	0		
13	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки.	0 Всего	аудиторні	ых часов		
13	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок.	0 Bcero 0	аудиторні	1		
13	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Методы	0 Всего	аудиторні	ых часов		
13	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Методы получения нанотрубок. Хиральность. Связь диаметра и	0 Bcero 0	аудиторні	ых часов		
	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Методы получения нанотрубок. Хиральность. Связь диаметра и индексов хиральности. Дефекты нанотрубок.	0 Всего 0 Онлай	аудиторні 0	З 3		
13	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Методы получения нанотрубок. Хиральность. Связь диаметра и индексов хиральности. Дефекты нанотрубок. Тема 9. Применение наноструктур.	0 Всего 0 Онлай 0	аудиторні 0	3 0		
	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Методы получения нанотрубок. Хиральность. Связь диаметра и индексов хиральности. Дефекты нанотрубок. Тема 9. Применение наноструктур. Практическое использование нанотрубок. Применение	0 Всего 0 Онлай 0	аудиторні 0 н 0	3 0		
	микроскопа. Реплики. Контраст. Тема 8. Нанотрубки. Свойства и характеристики углеродных нанотрубок. Одностенные и многостенные нанотрубки. Методы получения нанотрубок. Хиральность. Связь диаметра и индексов хиральности. Дефекты нанотрубок. Тема 9. Применение наноструктур.	0 Всего 0 Онлай 0 Всего	аудиторні 0 н 0 аудиторні 0 аудиторні 0	от часов 3 0 от транический при		

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Недели	Темы занятий / Содержание	
	8 Семестр	
1 - 8	Выполнение лабораторных работ	
	В течение семестра студенты выполняют работы из списка ниже, в группах по 2-3	
	человека, по индивидуальному графику.	
	1. Методы лазерного напыления тонких пленок	
	2. Профилометрия тонких пленок	
	3. Каталитические свойства халькогенидов переходных металлов	
	4. Атомно-силовая микроскопия	
9 - 15	Выполнение лабораторных работ	
	продолжение выполнения работ из списка	

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для успешного освоения материала курса рекомендуется посещение научных семинаров, конференций, проводимых в НИЯУ МИФИ и институтах РАН, популярных лекций приглашенных ученых

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие	
		(КП 1)	
ПК-1	3-ПК-1	3, КИ-8, КИ-12	
	У-ПК-1	3, КИ-8, КИ-12	
	В-ПК-1	3, КИ-8, КИ-12	
ПК-4	3-ПК-4	3, КИ-8, КИ-12	
	У-ПК-4	3, КИ-8, КИ-12	
	В-ПК-4	3, КИ-8, КИ-12	
ПК-1.3	3-ПК-1.3	3, КИ-8, КИ-12	

	У-ПК-1.3	3, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-1.3	3, КИ-8, КИ-12
ПК-1.4	3-ПК-1.4	3, КИ-8, КИ-12
	У-ПК-1.4	3, КИ-8, КИ-12
	В-ПК-1.4	3, КИ-8, КИ-12

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ H99 Solid-State Physics : An Introduction to Principles of Materials Science, Luth, Hans. , Ibach, Harald. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
- 2. 3H S98 Synchrotron Light Sources and Free-Electron Lasers: Accelerator Physics, Instrumentation and Science Applications, , Cham: Springer International Publishing, 2016
- 3. ЭИ М31 Введение в физику наноструктур : учебное пособие для вузов, Опенов Л.А., Маслов М.М., Москва: НИЯУ МИФИ, 2011
- 4. ЭИ Б 82 Лазеры: применения и приложения: , Ивакин С. В. [и др.], Санкт-Петербург: Лань, 2022
- 5. 620 Г87 Материаловедение для микро- и наноэлектроники : учебное пособие для вузов, Краснюк А.А., Громов Д.В., Москва: МИФИ, 2008
- 6. ЭИ А 19 Прикладной катализ : учебник, Аветисов А. К., Брук Л. Г., Санкт-Петербург: Лань, 2020
- 7. ЭИ М 92 Физические методы нанесения нанопокрытий : учебное пособие для вузов, Мухин В. С., Москва: Юрайт, 2021
- 8. ЭИ Ф50 Физические основы методов исследования наноструктур и поверхности твердого тела: учебное пособие для вузов, Троян В.И. [и др.], Москва: НИЯУ МИФИ, 2014
- 9. ЭИ Д 93 Электронные свойства и применение нанотрубок.—4-е изд., электрон. (Нанотехнологии): , Дьячков П. Н., Москва: Лаборатория знаний, 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 539.2 К55 Введение в нанотехнологию: , Кобаяси Н., М.: Бином, Лаборатория знаний, 2008
- 2. 539.2 К55 Введение в нанотехнологию: , Кобаяси Н., Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2005
- 3. 621.38 Н40 Зондовые нанотехнологии в электронике:, Неволин В.К., М.: Техносфера, 2005
- 4. 542 И 88 Исследование свойств катализаторов : Методические указания к выполнению лабораторных работ, , Балаково: БИТИ НИЯУ МИФИ, 2021
- 5. ЭИ А72 Методические указания и лабораторные работы по курсам "Технология наноструктур" и "Технология тонких пленок" : учебно-методическое пособие для вузов, Антоненко С.В., Москва: НИЯУ МИФИ, 2011
- 6. 621.38 Р25 Методы получения эпитаксиальных гетерокомпозиций: учебное пособие для вузов, Ратушный В.И., Ермолаева Н.В., Смолин А.Ю., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
- 7. 620 Н25 Наноматериалы и нанотехнологии : учебник для вузов, Калинин В.Т. [и др.], Запорожье: Мотор Сич, 2014

- 8. 620 Н25 Наноматериалы: свойства и перспективные приложения:, , Москва: Научный мир, 2014
- 9. 621.3 М29 Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники: , Мартин-Палма Р.Дж., Агулло-Руеда Ф., Мартинес-Дуарт Дж.М., Москва: Техносфера, 2007
- 10. 539.2 С89 Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов : , Суздалев И.П., Москва: Либроком, 2013
- 11. 535 А91 Оптические методы диагностики нанообъектов : учебное пособие, Зайцев С.А., Астапенко В.А., Москва: МФТИ, 2011
- 12. 539.2 Б 49 Получение тонких пленок реактивным магнетронным распылением : , Сейдман Л.А., Берлин Е.В., Москва: Техносфера, 2014
- 13. 530 Л22 Теоретическая физика Т.3 Квантовая механика. Нерелятивистская теория, Ландау Л.Д., : Физматлит, 2004
- 14. ЭИ А72 Технология тонких пленок : учебное пособие для вузов, Антоненко С.В., Москва: МИФИ, 2008
- 15. 539.2 X21 Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века : , Харрис П., М.: Техносфера, 2003
- 16. 533 Ц93 Физические основы плазменной и лазерной технологий : Учеб. пособие, Цыбин А.С., Москва: МИФИ, 2002

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

- 1. Nanonewsnet (http://www.nanonewsnet.ru)
- 2. Nanomarket (http://www.nanomarket.ru/)
- 3. Nanotech (http://www.nanotech.ru/)

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

После изучения курса студент должен твердо знать типы и виды наноструктур. Квантовые ямы, проволоки, точки. Понятие гетеропереходов. Свойства германия и кремния.

Свойства полупроводниковых соединений типа AIIIBV. Характеристики Твердые растворы (тройные сплавы) на основе соединений AIIIBV. Мелкие доноры и мелкие акцепторы. Дельталегирование. Понятие эпитаксии. Принципы молекулярно-лучевой эпитаксии. Особенности МЛЭ. Критическая температура эпитакии. Оптическая, электронная и рентгеновская Методы изготовления электрических контактов. Особенности двух четырехконтактой схемы измерений. Классический эффект Холла в случае одного и двух типов носителей. Метод Ван-дер-Пау. Измерение и применение вольтфарадных характеристик. Принципы резонансного туннелирования. Вольт-амперные характеристики трехбарьерного резонансно-туннельного диода. Генерация микроволнового излучения в квантово-размерных диодных резонансно-туннельных структурах. Понятие двумерного электронного газа. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла. Осцилляции Гааза. Понятие люминесценции. Особенности фотолюминесценции. Люминесценция свободных экситонов. Идентификация примесей. Фотолюминесценция квантово-размерных структур. Физические основы автоэлектронной эмиссии. Теория Фаулера-Нордгейма. Полевая эмиссионная микроскопия. Автоэлектронный и автоионный микроскопы. Принципы зондовой микроскопии. Сканирующий туннельный микроскоп. Режимы обратной связи. Параметры, влияющие на туннельный ток. Принципы атомно-силовой микроскопии. Контактная, полуконтактная, бесконтакная моды. Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения. Свойства и характеристики углеродные нанотрубок. Хиральность. Методы получения нанотрубок. Практическое использование нанотрубок. Применение наноструктур.

Студент должен уметь применять фундаментальные законы в области физики наноструктур для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, применять теоретические и компьютерные методы исследований в области физики наноструктур, производить поиск нужной информации в специальной научно-технической и патентной литературе по тематике исследований и разработок, применять экспериментальные методы электрофизических, оптических и структурных исследования наноструктур, а также владеть методами измерения вольтамперных, вольфарадных, магнитных, оптических и структурных характеристик нанообъектов.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

При чтении курса следует придерживаться следующей последовательности изложения. Сначала рассматриваются общие вводные понятия. Место наноразмерных объектов в окружающем нас мире. Подходы «снизу в вверх» и «сверху вниз». Манипуляции на квантовом уровне. Низкоразмерные физические системы. Квантовая механика — основа физики наноразмерных структур. Типы и виды наноструктур. Квантовые ямы, проволоки, точки. Дается понятие гетеропереходов. Гетеропереходы на основе полупроводников. Свойства германия и кремния. Свойства полупроводниковых соединений типа АШВV. Твердые растворы (тройные сплавы) на основе соединений АШВV. Мелкие доноры и мелкие акцепторы. Дельталегирование. Затем обсуждаются методы приготовления наноструктур. Понятие эпитаксии. Соизмеримость решеток. Лазерное и магнетронное распыление. Принципы молекулярнолучевой эпитаксии. Особенности МЛЭ. Критическая температура эпитакии. Оптическая, электронная и рентгеновская литография. Методы изготовления электрических контактов. Рассматриваются электрические методы исследования. Вольт-амперные характеристики. Особенности двух и четырехконтактой схемы измерений. Классический эффект Холла в случае

одного и двух типов носителей. Метод Ван-дер-Пау. Подробно изучается резонанснотуннельный диод. Принципы резонансного туннелирования. Вольт-амперные характеристики двух- и трехбарьерного резонансно-туннельного диода. Влияние температуры на свойства РТД. Генерация микроволнового излучения в квантово-размерных диодных резонансно-туннельных структурах. Вольтфарадные характеристики структур с квантовыми ямами. После этого переходят к теме, связанной с квантовыми явлениями в двумерном электронном газе. Понятие двумерного электронного газа. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла. Осцилляции Шубникова де Гааза. Экспериментальное изучение квантового эффекта Холла в двумерном электронном газе. После электрических свойств изучаются оптические методы Дается исследования наноструктур. понятие люминесценции. Флуоресценция, фосфоресценция, фотолюминесценция, электролюминесценция, радиолюминесценция, хемилюминесценция, кандолюминесценция. Особенности фотолюминесценции. Стоксовые потери. Люминесценция свободных экситонов. Фононные повторения. Экситонно-примесные уровни. Идентификация примесей. Фотолюминесценция квантово-размерных структур. структурных методом исследований изучаются автоэлектронная и автоионная эмиссия, сканирующая зондовая микроскопия нанообъектов, просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения. Заканчивается курс обсуждением свойств нанотрубок и применением применение наноструктур.

Во время проведения лекций желательно использовать проекционную технику, а также инициировать обсуждение материала методом «вопросов в аудиторию».

Автор(ы):

Руднев Игорь Анатольевич, к.ф.-м.н., доцент

Покровский Сергей Владимирович